

測れるから、創れる未来がある。

測定計測展

— 進化する“ものづくり”の品質確保へ —

精密測定機器、座標測定機セミナーのご案内

日程	9月13日(水)
時間	10:00 – 17:00
会場	東京ビッグサイト会議棟6階 605・606会議室
主催	日本精密測定機器工業会
聴講料	無料 (会員はテキスト代も無料。 会員以外はテキスト代をご負担下さい)
定員	会議室での聴講 250名

お申込方法	日本精密測定機器工業会HPからお申し込みください。 https://www.jpamia.gr.jp/information/ ※お申込み多数の場合は途中で募集を打ち切ることがあります。
お問い合わせ先	日本精密測定機器工業会「セミナー」事務局 〒105-0003 東京都港区西新橋3-14-2 TEL. 03-3434-9557 FAX. 03-3434-1695 E-mail. info@jpamia.gr.jp



プログラム

※内容は予告なく変更される場合があります。

10:05 10:50	精密計測とAI 大阪大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 准教授 水谷 康弘 氏 機械学習やAIを用いた推定の精密計測技術への導入について、学習アルゴリズムの物理的な意味から生産システムの予測に至る考え方を「推定不確かさ」というキーワードを中心に基礎から実施例を紹介する。
10:55 11:40	回転基準器によるCMMプローブ形状誤差のその場測定 富山県立大学 工学部 知能ロボット工学科 准教授 伊東 聡 氏 本研究はCMMプローブ球の形状偏差をCMM上でsub- μm 精度で自律的に計測するために、回転可能な基準器を用いた独自の形状偏差測定法を考案し、不確かさの評価に基づいた提案手法の有効性の検証について紹介する。
11:45 12:30	複雑形状の三次元測定の不確かさ評価 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ 研究員 渡邊 真莉 氏 近年、産業部品の形状はますます複雑化し、三次元測定を利用した品質管理の重要度が増している。本講演では曲率をもった形状を接触式測定機によりスキャニング測定するときの、不確かさの見積もりについて紹介する。
12:30–13:30	昼食休憩
13:30 14:15	今後の計測技術に期待すること 株式会社クリスタル光学 技術開発部 部長 中川 寛之 氏 様々な高精度部品の受託加工を行う当社にとって、計測はお客様と我々を繋ぐ大変重要な技術です。三次元測定機、干渉計などを使用する中で感じる課題や、当社の取組について紹介します。
14:20 15:05	IATF16949の動向 一般財団法人日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 幾何計測課 副参事 富山 一男 氏 IATF16949規格誕生の経緯と最近の動向、及びIATF16949規格に関するISO/IEC17025試験所認定機関の取り組みと活用について紹介する。
15:05–15:20	休憩
15:20 15:45	測定プローブのシャフト材質による測定結果への影響 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所 情報・生産技術部 システム技術グループ 阿部 顕一 氏 長いスタイラスや延長シャフトにより測定範囲を拡大できますが、たわみや振動による測定への悪影響が予想されます。シャフトを延長した際、どの程度まで長くできるのかを比較しましたので、その結果をご報告します。
15:50 16:15	CMM都市伝説：オートフォーカスを用いた画像測定機におけるフォーカス時諸条件が高さ測定へ及ぼす影響 地方独立行政法人 山口県産業技術センター 技術支援部 製品技術グループ 専門研究員 近藤 拓郎 氏 高さ方向の測定にオートフォーカスを用いた三次元画像測定機において、オートフォーカス時の拡大倍率やフォーカス範囲、測定対象の表面性状といった諸条件が測定結果に及ぼす影響について検証を行った。
16:20 16:45	部分測定による測定結果の影響 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ グループ長 鍛島 麻理子 氏 CMMの測定値から当てはめ形体を算出する際、当てはめ形体の一部しか測定点がない部分測定では、結果のばらつきが大きくなる可能性がある。部分測定の注意点を解説する。